軟磁性用ディジタル化 M−H ループトレーサー

Digital M-H Loop Tracer for Soft-Magnetic Thin Films

姜 小明・鈴木俊行 九州芸術工科大学,福岡市南区塩原 4-9-1 (●815-8540)

X. Jiang and T. Suzuki Kyushu Institute of Design, *Shiobaru 4-9-1, Fukuoka 815-8540*

Analysis of the measuring sensitivity of a conventional M-H loop tracer revealed that the sensitivity is limited by undesirable signals, caused by imbalance of a pick-up coil pair, use of a non-ideal electronic integrator, and/or the presence of ambient magnetic or conductive bodies. Most of these noises are periodic and synchronized with the exciting magnetic field at 50-60 Hz. This paper proposes a new scheme utilizing digital signal-processing technique and virtual instrument software, to reduce such noises effectively, taking account of the above-mentioned noise properties. In the scheme, a pick-up coil signal without a magnetic thin film is first sampled and stored in memory as a background noise, then another signal with the thin film is sampled and the stored background noise is reduced. A pick-up coil pair, linear amplifiers, and digital-signalprocessing software were optimally designed and installed. A newly designed M-H loop tracer can measure thin softmagnetic films with a magnetic moment as small as 2.5 imes10⁻⁵ emu.

Key words: *M*-*H* loop tracer, magnetic measurement, softmagnetic material, virtual instrument

1. はじめに

近年,各種磁性材料を使用する部品の高性能化,小型化に伴い,使用される磁性材料そのものも小型化・薄膜化の傾向が著しい.磁気記録機器においても,例えば,薄膜磁気ヘッドから磁気抵抗効果型ヘッド(MRヘッド),さらには巨大磁気抵抗効果型ヘッド(GMRヘッド),さらには巨大磁気抵抗効果型ヘッド(GMRヘッド)へと開発が進むにつれて,使用される軟磁性薄膜はその膜厚が数 μ mから数 nmへと薄膜化している^{1)~3)}. これらの極薄軟磁性体の磁気特性評価は,その薄膜化に伴う測定試料の磁気モーメント低下により,従来のM-H $\mu-プトレーサでは測定が困難となっている. このため,磁気 モーメント 10⁻⁴ emu 以下の磁気特性をも比較的簡便に測定できる<math>M-H$ $\mu-プトレーサが求められている.$

本稿では従来のM-H ループトレーサーにおいて、その感度 および精度が制限される原因を徹底的に分析した上で、ディジ タル信号処理による新たなノイズ低減法を提案し、同時に検出 コイルの最適化とアンプ系の高精度化を図った。それに基づい て試作したディジタル化M-H ループトレーサーを用いて、厚 さ 7.5 nm、面積 2×2 mm²、磁気モーメント 2.5×10⁻⁵ emu の 極薄膜軟磁性試料でもその磁気特性を測定することができるよ うになったほか、今まで不可能であった試料の導電性基板ある いは磁性下部層の影響を除去した磁性層のみの磁気特性測定も 可能となったので報告する.

2. 従来型 M-H ループトレーサーの問題点

2.1 従来型 M-H ループトレーサーの構成

Fig. 1 に従来用いられている代表的な M-H ループトレー サーの構成図を示す. この M-H ループトレーサーでは, 同図 (a) に示すように, 商用電源をヘルムホルツコイルに供給し, 励 磁磁界を発生させる. 励磁磁界の振幅は励磁電流に比例するも のとして,抵抗 R_c により検出する. 励磁磁界により, ヘルムホ ルツコイル中心軸上に置かれている試料を磁化し, 検出コイル によってその磁化に比例する微弱な電圧 Vを検出する.

Fig. 1(b) に検出コイルと試料の位置関係を示す。一対の検出 コイルはヘルムホルツコイルと直交配置し、電気的に逆相に接 続する.この構造は、検出感度が多少犠牲になるものの、基本 的に励磁磁界を検出しないことと、検出コイルの上部に試料を 配置し、試料を自由に回転させることができるため、試料の異 方性方向を容易に特定できるという特徴を有している.

しかし, 直交配置, 逆相接線にもかかわらず, 検出コイル対 のアンバランスによって, 打ち消しきれなかった励磁磁界によ る電圧が磁化信号とともに検出される. 打ち消しきれなかった 電圧を未キャンセルノイズ電圧と呼び, Fig.2 にその一例を示 す. この未キャンセルノイズ電圧を, H 信号の位相と振幅を調 整した電圧により, 差動アンプで除去する構成となっている. 未キャンセルノイズ電圧の影響を除いた磁化による電圧を積分 して, 試料の磁気モーメントを求め, 励磁信号 H と一緒にオシ



Fig. 1 Conventional *M*-*H* loop tracer.



Fig. 2 H-signal and undesirable V-signal without sample, caused by imbalance of a pick-up coil pair and the presence of ambient conductive or magnetic bodies.

ロスコープに送って *MH* ループを描く.

2.2 従来型 M-H ループトレーサーの問題点 H信号を利用して, 未キャンセルノイズ電圧を打ち消す効果 は、未キャンセルノイズ電圧の波形に大きく依存するが、未 キャンセルノイズ電圧は外来ノイズの影響で完全な正弦波の形 にならないため、この方法では、これを完全に除去することが できない。特に、ヘルムホルツコイルの励磁磁界の範囲内に導 電体や測定試料以外の磁性物が存在する場合には、導電体に渦 電流が生じたり、磁性物が磁化されたりすることによって、励 磁磁界の分布が空間的あるいは時間的に変化し、その結果、測 定試料近傍に作用する励磁磁界の均一性が悪くなり、励磁磁界 による誘起電圧を一対の検出コイルで打ち消す効果がさらに低 くなるほか、未キャンセルノイズ電圧の波形自身にも歪みを生 じさせ, 測定した M-H ループが 8 の字を描いたり, ループが 開いたりする主な原因となる。また、実際に試料に作用する磁 界と励磁電流の間に位相ずれを生じ、測定精度を劣化させる原 因となる.これらは励磁磁界強度によって変化する非直線性ひ ずみとなって現れる. M-H ループトレーサーが, 鉄骨で建てら れた建物の中に置かれる限り,壁,床中の金属が測定精度およ び感度に与える影響を避けることはできない.

さらに,理論値に近い結果を出すアナログ積分器を電子回路 で製作することは非常にむずかしいため,サグの発生などによ り不完全な積分波形となり,*M*-H ループは変形する.

3. 基本設計コンセプト

前述の分析から、検出コイルのアンバランスによる電圧を効 果的に除去できないことが測定感度が制限される主な原因であ ることと、さらに、アナログ積分器のサグが測定精度を劣化さ せることがわかった.これらのことを考慮して、新しいディジ タル化 *M*-*H* ループトレーサーは測定の簡便さを保ちつつ、感 度と精度を向上するため、構成を以下のようにする.

(1) 検出コイルの構造: 試料の異方性方向を容易に特定でき る特徴を生かすため,従来型と同様な直交配置の試料回転方 式の構造とし,検出コイルの最適設計を行う.

(2) 測定方式: アナログ回路はプリアンプなどのリニアアン プのみとし,他をディジタル化した測定方式にすることよっ て,計算機と連携するようにする.これによって,柔軟な信



Fig. 3 Functional block diagram of a newly developed digital M-H loop tracer.

号処理が使えるようになるほか、測定結果の保存も簡単に実 現できる.

(3) 未キャンセルノイズ電圧の消し方: 試料未挿入時の検出 コイルのアンバランスによる電気信号をバックグランドノイ ズとして計算機のメモリに保存する.次に試料挿入時の電圧 を取り込み,バックグランドノイズを差し引くことによっ て,未キャンセルノイズ電圧を除去する.

(4) 積分器: ディジタル化シンプソン数値積分器を用いる.

(5) 測定条件: 試料直径は 6 mm, 測定周波数は 50~60 Hz とする.

以上の基本設計に基くディジタル化 *M*-*H* ループトレーサー の構成を LabVIEW ソフト (National Instrument 社製)を使 用して実現した. その機能構成図を Fig. 3 に示す.

ディジタル化 M-H ループトレーサーでのノイズのキャンセ ル方法は,以下の手順で行う.まず,ある大きさの励磁磁界を かけ, 試料を入れない状態で V チャンネルから1回信号を取 り込む、取り込んだ信号の中には検出コイルの非対称性による 未キャンセルノイズ電圧、外来ノイズ、周辺金属などからのノ イズを含んでいる. これをバックグランドノイズとしてメモリ に保存する.次に、試料を入れて、試料の磁化に比例する信号 電圧と上記のノイズ電圧の合わさった電圧を取り込み、キャン セル部分で先に取り込んだバックグランドノイズを差し引い て、試料の磁化による信号電圧のみを求める、このような方法 により、検出コイルの非対称性による影響はもちろん、周囲環 境からの影響もほとんど除去することができる. ノイズの影響 を取り除いた磁化信号 Ⅴを, 精度 10⁻⁵を有するシンプソン型 ディジタル積分器で積分し、その試料の正確な磁気モーメント を求める. 求めた磁化信号 M と磁界信号 H により磁化曲線を 描く.

このノイズキャンセル方式は、検出コイルの非対称性による 未キャンセルノイズ電圧、外来ノイズ(主として電源誘導ノイ ズ)、あるいは、周囲金属類の影響によるノイズなどが、いずれ も商用電源周波数に同期し、かつ励磁磁界強度に依存している 性質を利用したものである。したがって、励磁磁界として商用 電源周波数とは異なる周波数の電源を用いる場合には、励磁磁 界発振器を商用電源に同期させる必要がある。商用電源の電圧 不安定性は、ノイズキャンセルの効果を悪くする一つの原因で あるため、この設計では、商用電源に同期したより安定な発振 器を導入した。

励磁コイルに長時間電流を流す場合, ヘルムホルツコイルと

電流検出用抵抗の発熱による影響を防ぐため、ディジタル化 *M-H ループトレーサーでは、 励磁電流安定化回路を取り入れ* た.さらに、使用上の便利さを考えて、AGC 回路を付加して計 算機により設定磁界の制御ができるように設計した。

4. 具体的な設計例

4.1 検出コイルの最適化設計

検出コイルの性能は、測定器の性能を大きく左右するため、 より高感度、高 S/N をもつ最適な検出コイルの設計を行った。

検出コイルの感度は、相反定理により、検出コイルに単位電 流を流すとき、試料の位置に発生する磁界分布に等しくなる. 以下に検出コイルに単位電流を流したときの磁界分布を計算す る. Fig. 4 に示す検出コイルの寸法パラメータを以下のように 決める.

内寸法= $2a \times 2b$	コイルの厚さ=t
二つのコイルの中心間隔=2g	コイルの高さ=h
試料-コイル間の間隔=s	試料直径=d

一つの検出コイルの中心を原点とする座標系について,着目 点 P(x, y, z)における磁界の X 成分 $H_x(x, y, z)$ を次式により求 める.

$$H_{x}(x, y, z) = \frac{nI}{4\pi ht} \left\{ \int_{a-t}^{-a} dx' - \int_{a}^{a+t} dx' \right\}$$

$$\times \ln \left\{ \frac{(y+b+t) + \sqrt{(x-x')^{2} + (y+b+t)^{2} + z^{2}}}{(y-b-t) + \sqrt{(x-x')^{2} + (y-b-t)^{2} + z^{2}}} \right\}$$

$$\times \frac{(y-b-t) + \sqrt{(x-x')^{2} + (y-b-t)^{2} + (z+h)^{2}}}{(y+b+t) + \sqrt{(x-x')^{2} + (y+b+t)^{2} + (z+h)^{2}}} \right\} (1)$$

式(1)を用いて、二つの検出コイルが逆相接続されている場合の試料全面の磁界分布を計算することができ、単位電流に対するこの磁界分布を検出感度分布とする。Fig.5はこの計算方法により求めた検出コイルのX方向の検出感度分布の例を示す、Y方向の感度分布はX方向のそれに似ているため、省略する、いま、感度分布の平坦性Fを以下のように決める。

$$F = \frac{\Delta H}{H_0} \times 100\% \tag{2}$$

ここに、 H_0 は感度分布の中心値(以下感度という)であり、 ΔH は感度分布の試料領域(-3 mm < x, y < 3 mm)における最 大変動幅である。平坦性は F 値が小さいほど良好であり、試料 全域より均一に磁束を検出することになる。すなわち、性能指 数を H_0/F と定義すると、最適設計は検出コイルのパラメータ (a, b, h, t, k)に対して、この性能指数を最大にすることになる が、 H_0 が簡単な解析解で与えられないため、この論文では、 個々のパラメータに対する F 値および感度の依存性を調べ、最 適な検出コイルを探索した。

まず,検出コイルの形状 a/b を変化したときの感度および平 坦性を Fig. 6 に示す. a/b>2 では, a/b の影響は比較的小さ い. ここでは,平坦性に着目し $a/b=2\sim3$ とする. 同様に,検 出コイルの内径 $2a\times 2b$ を変化したときの感度および平坦性の 変化を調べた結果,これらの値は $2a\times 2b=160$ mm² でほぼ飽 和し,内径の大きなコイルは,感度や平坦性にあまり貢献しな いため,大寸法を求める必要がないことがわかった.検出コイ ルは磁化信号を検出するだけではなく,周囲の磁気ノイズも同



Fig. 4 Definition of parameters for a pick-up coil pair and a sample.



Fig. 5 Sensitivity curve of a pick-up coil pair for the conventional M-H loop tracer, and definitions of H_0 and ΔH . Parameters: a=9 mm, b=16 mm, h=4 mm, t=3 mm, k=2 mm, s=2 mm.



Fig. 6 Flatness and sensitivity as functions of the coil aspect ratio a/b. Parameters: $2a \times 2b = 160 \text{ mm}^2$, h=3 mm, t=6 mm, k=0.2 mm, d=6 mm, s=2 mm.

時に拾う、ノイズを考慮に入れると、検出コイルの寸法はでき るだけ小さい方が良い、 $2a \times 2b = 160 \text{ mm}^2$ とすると、F 値が 5% 以下であり、感度も十分得られる、このとき、a = 10 mmであり、b = 4 mm である、

Fig. 7 は、二つの検出コイルの隙間 k の影響を調べた結果で ある. これより、k の増大で、検出感度が低くなることは明ら かであるが、k=0.35 mm のときF=0 となり、感度分布はほ ぼ平坦になることがわかった. Fig. 8 はコイルの高さh の影響 を示している. これによれば、h を増加させていくと、感度が 上がっていき、平坦性も良くなっていく、一方、h が 4 mm を 超えると、感度が低下し、平坦性も急激に劣化する. h=3 mm のとき、F=3%、 $H_0=0.8$ 以上有するため、これを最適高さと する. したがって、t は 6 mm となる. すなわち、検出コイル

日本応用磁気学会誌 Vol. 22, No. 7, 1998



Fig. 7 Flatness and sensitivity as functions of the gap between pick-up coils. Parameters: a=10 mm, b=4 mm, h=3 mm, t=6 mm, s=2 mm, d=6 mm.



Fig. 8 Flatness and sensitivity as functions of the coil height, h. Parameters: a=10 mm, b=4 mm, $h \times t=$ 18 mm², d=6 mm, s=2 mm, k=0.35 mm.



Fig. 9 Sensitivity curves for new and old pick-up coils.

は、平坦に巻いた方が良いとわかった.

以上4つのシミュレーションを通じて、感度と平坦性の良い コイルの寸法および形を求めてきたが、その最適な寸法は以下 のとおりである。

2a=10 mm, 2b=4 mm, 2k=0.7 mm, h=3 mm, t=6 mm, s=2 mm

Fig.9に,現用10mm¢試料検出コイルと新しく設計した6 mm¢ 試料検出コイルの特性を比較している. これによれば, 新設計の検出コイルは,感度および平坦性が倍以上に向上して いることがわかる.

4.2 増幅アンプの設計

検出信号 V の周期は 60 Hz であるが,検出パルスの勾配が 非常に急峻であるため,V チャンネルアンプの帯域は,検出パ



Fig. 10 Effect of amplifier phase shift on H_c , calculated from M-H loops.

ルスの最も急峻な立ち上がりに対応する時間により決められ る. 励磁磁界が 5~80 Oe の間であれば,検出コイルによる検 出信号の振幅は大体 5~400 mV であり,検出パルス立上がり 時間に対応する周波数は 3~100 kHz の間で変化する. 増幅し た V 信号を,入力範囲 5 V の A/D コンバータに供給する. サ ンプリング精度を高めるため, A/D コンバータの入力のピー ク値が常に±3~±5 V の間になるように, この設計では, PGA(Programmable Gain Amplifier)を用いて増幅を行う. 必要ゲインは 20~60 dB となる.

次に、 $M-H \mu - \tau > \nu - \tau < t + \delta V$ 信号の位相差が極めて重要である. V信号が増幅される前後の位相にずれが生じると、 H_c の値が変わる. 計算機シミュレーシュンにより求めた位相ずれが H_c の値に与える影響を Fig. 10 に示す. H_c の精度を 1% 以内に確保するためには、増幅される V 信号の位相ずれを 0.5°以下に抑える必要がある. 以上のことを考慮に入れて V チャンネルアンプ、H チャンネルアンプとも十分な余裕を持たせてアンプの帯域は最低 1 MHz とし、増幅前後の位相が変わらないように、60 dB のゲインを 3 段にわけて得ることにした. 同様の考慮は H チャンネルアンプについても必要であり、H チャンネルアンプにも PGA を採用している.

4.3 ソフトの設計

この設計では、上述のディジタル信号処理を、仮想計測器 LabVIEW を用いて行う、そのソフトの主な流れを Fig. 3 の点 線に囲まれる部分に示す、

AD変換器は、H、V 信号に対し、一周期ごとに 3000 点のサ ンプルを同時に取り込む. ディジタル化 *M*-*H* ループトレー サーのノイズのキャンセル機構は、保存されたバックグランド ノイズの振幅と位相が、V 信号に含まれるノイズの振幅と位相 に等しい場合、すなわち、励磁磁界に同期した(したがって、 商用電源に同期した)定常ノイズに対して効力を発揮する. し たがって、H 信号に同期した周期的なトリガを用いて、サンプ リングを行う. さらに、このトリガを用いて、H、V 信号におい て同期平均化を行うことによって、ランダムノイズを低減す る.

このように、LabVIEW ソフトは、ノイズキャンセリングの ほか、リニアアンプの自動ゲイン設定、励磁磁界設定、磁気 モーメントを求める数値積分、*M-H* ループからの H_c や角型比 などのパラメータ計算、データの表示と保存、およびシステム 全体の制御を行う.

5. 測 定 例

試作したディジタル化 *M*-*H* ループトレーサーを用いて, Table 1 に示す試料 A について最大測定磁界 10, 40, 80 Oe を かけて磁化容易軸方向と困難方向方向の *M*-*H* ループを測定し た結果を Fig. 11 に,また試料 B, D に対しては最大磁界 10 Oe をかけて磁化容易軸方向の *M*-*H* ループを測定した結果を Fig. 12 にそれぞれ示す.なお,図の *M*-*H* ループの縦軸の値は,試 料 A を用いて VSM での測定値に対して校正している.Fig. 11 からわかるように,ディジタル化 *M*-*H* ループトレーサー は,磁気モーメント 2.3×10⁻³ emu の試料に対し,磁界の大き さにかかわらず,*M*-*H* ループを正確に測定できる.Fig. 12 に よると,従来測定できなかった最も磁気モーメントが小さい試 料 D (2.5×10⁻⁵ emu) においても,磁化容易軸方向の磁化特性 を測定できることがわかった.なお,試料 D の面積は他の約 1/11 であるため,6 mm¢ の試料面積に換算すると,膜厚は

Table 1 Test samples

Sample	Composition	Thickness (nna)	Area (mana²)	Moment ⁽¹⁾ (emu)
(A)	Unknown	Unknown	7×7	2. 3 × 10 ⁻³
(B)	NiFe	10	7×7	2.5×10-4
(C)	NiFe/Ta	3	7×7	5.6×10⁻⁵
(D)	NiFe	7.5	2×2	2.5×10-5

 Magnetic moment was measured by a VSM at the maximum field of 40 Oe.



Fig. 11 M-H loops in the easy and hard directions for sample A, with maximum magnetic fields of 10, 40, and 80 Oe.

1.2 nm に相当する.

ディジタル化 M-H ループトレーサーのノイズキャンセルの 構成は、電源周波数に同期した周期性ノイズと、アンプのオフ セット電圧のような直流電圧のみに対応するため、アンプの熱 ノイズ、コイルが拾った高周波電気信号などのランダムノイズ をキャンセルできない、平均化によって、ランダムノイズは低 減されるが、高周波数ランダム波に変調された低周波数ランダ ムノイズに対して平均化の効果が少ない、観察結果から、今回 試作のディジタル化 M-H ループトレーサーは、磁気モーメン 2.5×10⁻⁵ emu の試料に対しても比較的精度良く測定できて おり、最大印加磁界強度にもよるが、感度として 10⁻⁵ emu 程



Fig. 12 *M*-*H* loops in the easy axis direction for samples B and C, with a maximum magnetic field of 10 Oe.





Fig. 13 Example of removing the effects of a magnetic sub-layer.

日本応用磁気学会誌 Vol. 22, No. 7, 1998





(a) The effect of a conductive substrate is included

Fig. 14 Example of removing the effect of a conductive substrate.

度を達成していると結論できる.

6. 応用例

本測定器の興味ある応用例として,導電性基板および磁性下 部層の影響を除去した磁性層のみの測定がある.軟磁性薄膜を 付着する基板が下地層を含めて,導電性あるいは磁性を有する 場合は,磁性層が非常に薄くなると,その基板の存在が,渦電 流損,磁化損を通じて磁化曲線に影響を与える.ディジタル化 *M*-*H*ループトレーサーは設計の構造上,基板のみを挿入して 測定した信号をバックグランドノイズとして取り込むことよ り,基板の影響を取り除いた磁性層のみの磁化曲線を測ること が可能である.この応用例の実験には以下の試料を用いた.

- ・磁性層試料: 試料 B. 試料 B は磁気モーメントが高く,かつ ガラス基板を使用するため,試料自身の基板の影響を無視で きる.
- ・模擬基板 A: 試料 C.
- ・模擬基板 B: 面積 10 mm×10 mm, 厚さ数µm のアルミ箔.

実験結果を Fig. 13, 14 に示す. Fig. 13, 14 の各 (b) に示す基 板の影響を除去した結果を Fig. 12 の結果と比べると, その差 がほとんどないことから, ディジタル *M*-*H* ループトレーサー は導電性あるいは磁性を有する基板の影響を分離して測定でき るとわかった.

今回試作したディジタル化 *M*-*H* ループトレーサーは,以下の性能を達成した.

- 本測定器により 2.5×10⁻⁵ emu の軟磁性薄膜の M-H ループが測定可能となった.
- (2) 本測定器は、励磁用ヘルムホルツコイルの近傍に金属や 磁性体が存在しても、これらの影響を除去する能力があ り、正確な測定結果を得ることができる。したがって、 本測定器は、置き場所によらず、高精度の測定結果を得 ることができる。
- (3) 本測定器の応用例として,基板の材料にかかわらず,その影響をほとんど取り除いた磁性層のみの磁気特性を測定することが可能である.

謝 辞 本研究は株式会社テスラとの共同研究の一環として 行ったものである。

献

1) 石綿延行: 日本応用磁気学会誌, 18,744(1994).

文

- 2) 越川誉生,上原裕二,大塚善徳,戸田順三,小林和雄:日本応用 磁気学会誌,18,764(1994).
- 3) 中谷亮一,星屋裕之,杉田 愃:日本応用磁気学会誌,18,770 (1994).

1998年3月5日受理, 1998年5月7日採録